

## 2021年度 第13回 LSI テストセミナー

日時：2022年3月17日（木）10時～21時

場所：天神クリスタルビル B ホール 〒810-0001 福岡市中央区天神 4-6-7

TEL: 092-733-1310

10時～10時15分 会場設営・受付

10時15分～10時20分 オープニング 細川 利典（日本大）

10時20分～10時55分

同時検出故障情報を用いた低消費電力指向テスト生成法

○三浦怜，細川利典，山崎紘史（日本大），吉村正義（京都産大），新井雅之（日本大）

10時55分～11時30分

Functional Safety of AI Accelerators with Hardware Defects

○Bumun Lim (KIT), Stefan Holst (KIT), Xiaoqing Wen (KIT)

休憩（11時30分～11時40分）

11時40分～12時15分

故障活性化率向上指向テスト生成の診断分解能評価

千田祐弥，○細川利典（日本大），山崎浩二（明治大）

12時15分～12時50分

小型加速度センサタグを用いたスポーツの動作解析に関する研究

○岡幹久，磯田歩奈，安武乃慧瑠，宮瀬紘平（九工大）

休憩（12時50分～14時）

14時～14時35分

論理回帰を用いたサンプリングベースの論理合成手法について

○植村友近，松永裕介（九州大学）

14時35分～15時10分

疑似ブル最適化問題を用いた FFR 遷移と WSA 相関に基づく低消費電力指向ドントケア割当て法

○Yanling Xu，三浦怜，細川利典（日本大），吉村正義（京都産大），新井雅之（日本大）

15時10分～15時45分

FALL 攻撃に耐性のある RTL における SFLL-hd に基づいた論理暗号化手法

野口葉平・○吉村正義（京都産大）・辻川敦也・細川利典（日本大）

休憩（15時45分～15時55分）

15時55分～16時30分

テスト並列化のためのコントローラの制御信号のドントケア割当て法

Haofeng Xu, ○細川利典, 山崎紘史（日本大）, 吉村正義（京都産業大）, 新井雅之（日本大）

16時30分～17時5分

RO-PUF に対する機械学習攻撃について

○真木優弥・吉村正義（京都産大）

17時5分～17時40分

レイアウト画像に基づく欠陥位置推定法の評価のためのモデル画像の生成に関する検討

川口 大樹, 藤田 樹 永村 美一（都立大）, ○新井 雅之（日大）, 福本 聡（都立大）

休憩（17時40分～18時）

18時～21時

LSI テストに関する討論（グループ別討論）